

HVCMOS meeting

2023.12.19

参会：李乐怡，李一鸣，陆卫国，项治宇，谢坤妤，徐子骏，周扬

- 治宇介绍LL工艺sensor测试更新（见附件幻灯片）
 - 之前激光测试噪声随偏压曲线有误，原因是误将其他通道当做信号道
 - 同时诊断出激光未被触发时也有较弱的光，并不能当成本底，须彻底关电源
 - 比较红光（640nm）和红外（1054nm）：红光在硅微条中信号更强更适合用于测试
 - 调整激光聚焦、光斑位置和触发延迟时间，找到最优工作点
 - 在最优工作点下，红光信号在LL芯片（8像素并联）用IDE1140读出芯片产生信号约为28 ADC count，噪声仅3.5 ADC
 - 下一步计划：设计专门测试板用于sensor测试
 - 周扬：以上结果是500Hz下得到，其他频率情况如何？治宇：试过5MHz信号更小；计划尝试更低频率。
- 一鸣介绍SMIC系列芯片命名提案
 - 动机：便于交流宣传；多版本同时测试时避免混乱
 - 考虑：体现先进制程；不局限于单一实验应用、特定单位；上口易记
 - 提议：CMOS sensOr in Fifty-FivE nm procEss (COFFEE)
 - 2022.10MPW芯片：COFFEE1; 2023.08MPW芯片：COFFEE2